

CEI 60749-7
(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –

Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne
et analyse des autres gaz résiduels

IEC 60749-7
(First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 7: Internal moisture content measurement
and the analysis of other residual gases

CORRIGENDUM 1

Page 4

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 5

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.